

Test de configurabilidad para circuitos analógicos embebidos

Resumen

Se expondrá una estrategia de auto-test denominada Test de configurabilidad analógico, para un circuito embebido. El circuito bajo test está compuesto por amplificadores operacionales y recursos de interconexión presentes en el procesador MSP430 de Texas Instruments. La estrategia en cuestión emplea recursos de hardware y software del procesador, minimizando la sobre-asignación de recursos de test. La propuesta consiste en programar un conjunto reducido de configuraciones disponibles para el circuito bajo test y testear su funcionalidad mediante la medición de unos pocos parámetros clave.

EDUARDO ROMERO y GABRIELA PERETTI

Eduardo Romero y Gabriela Peretti, Doctores en Ingeniería Mención Electrónica, son Profesores Titulares de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María, Argentina.

Desempeñan sus tareas docentes en el Departamento de Ingeniería Electrónica. Realizan tareas de investigación en el Grupo de Estudios en Calidad en Mecatrónica de la misma facultad, en el área de test de circuitos y sistemas analógicos y de señal mixta.